Национальный исследовательский Институт «Московский Энергетический Институт»

ДИПЛОМНАЯ РАБОТА

ТЕМА: «ГЕНЕРАТОР, ЗАДАЮЩИЙ 16-БИТНУЮ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ

Студент гр.Э-05-12 Сипарова Анна Павловна Научный руководитель: ст.пр. Ануфриев Ю.В.

» ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ:

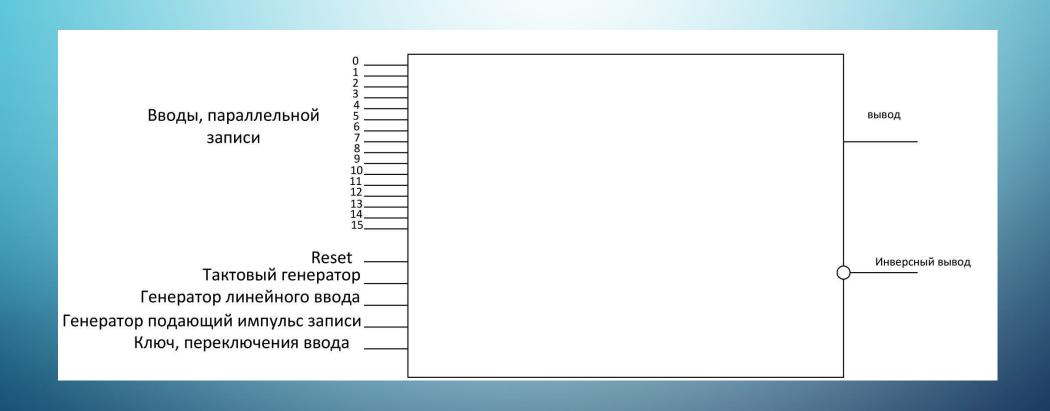
☐ Спроектировать ИС: генератор, задающий 16-битную последовательность в базисе ТТЛ с щелевой изоляцией с технологической нормой 1,5 мкм, со следующими параметрами слоев:

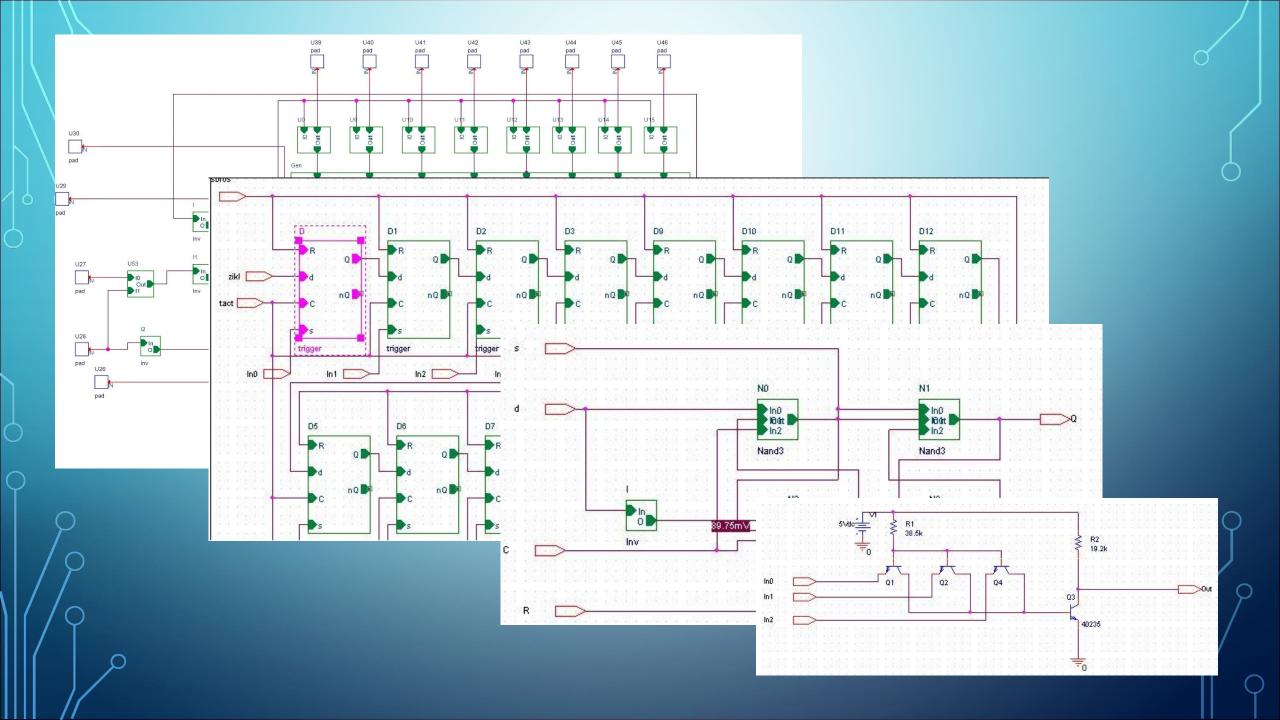
| Nº | Функции слоя | Тип | Толщина, | Удельное |
|----|---------------------|-----------------|----------------|-----------------------------|
| | | проводимо | MKM | сопротивление |
| | | | | ρ _s Ом/кв (или ρ |
| | | | | Ом×см) |
| 1 | Подложка | р | 300 ± 30 | (10 ± 3) |
| 2 | Скрытый слой | n ⁺ | | 50 ± 12 |
| 3 | Эпитаксиальный слой | n | 1.7 ± 0.3 | (3 ± 1) |
| 4 | Разделительные | p ⁺ | 2.5 ± 0.4 | 25 ± 5 |
| | области | | | |
| 5 | Глубокий коллектор | n ⁺ | 2.3 ± 0.4 | 30 ± 6 |
| 6 | База пассивная | p ⁺ | 1.0 ± 0.2 | 200± 40 |
| 7 | База активная | р | 0.6 ± 0.15 | 2000 ± 500 |
| 8 | Эмиттер | n ⁺⁺ | 0.3 ± 0.1 | 50 ± 10 |
| 9 | Защитный/изолирующ | | 0.6 ± 0.1 | |
| | ий слой | | | |
| 10 | Металлизация | | 0.7 ± 0.1 | |

КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ:

- □ Разработка логической структуры
- □ Технологическое проектирование
- □ Физико-топологическое проектирование
- □ Проектирование электрической схемы и топологии базовой ячейки

РАЗРАБОТКА ЛОГИЧЕСКОЙ СТРУКТУРЫ УСТРОЙСТВА





ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ

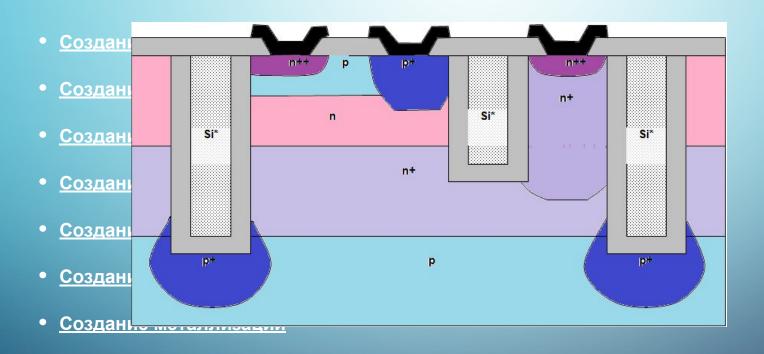


- разработка технологического маршрута изготовления транзистора
- ✓ расчёт режимов технологических операций
- ✓ расчёт параметров получаемой структуры



Расчет конструктивно технологических ограничений

Разработка технологического маршрута изготовления транзистора



РАСЧЁТ РЕЖИМОВ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ

$$Q = 2N_s \sqrt{\frac{D \cdot t}{\pi}}$$

 $Q = 2N_s\sqrt{rac{D\cdot t}{\pi}}$ количество атомов примеси, поступившее из полуограниченного источника за время t

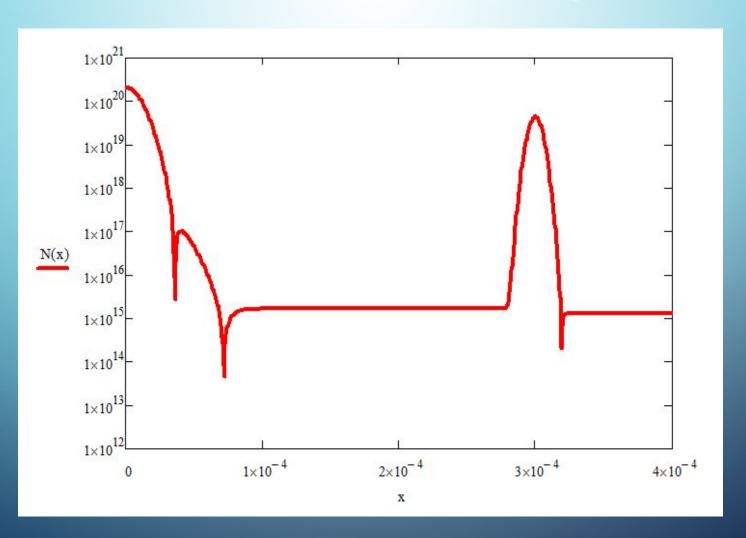
$$\rho_s = \left(q \cdot \int_0^{h_{cnon}} \mu(N) \cdot N(x) dx\right)^{-1}$$
 Удельное сопротивление

$$W = \sqrt{4 \cdot D \cdot t \cdot \ln \left(\frac{Q}{\sqrt{\pi \cdot D \cdot t} \cdot N} \right)}$$
 толщина слоя

$$N(x,t) = \frac{Q}{\sqrt{\pi \cdot D \cdot t}} \cdot \exp\left(-\frac{x^2}{4 \cdot D \cdot t}\right)$$
 распределение примеси, по функции Гаусса

$$t_{3ae} = \frac{\pi}{D} \cdot \left(\frac{Q_{\Gamma_{Луб.кол.}}}{2 \cdot Ns_{\Gamma_{Луб.кол.}}} \right)^2$$
 Время загонки

Эффективное распределение легирующей примеси структуре



РАСЧЕТ КОНСТРУКТИВНО ГЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ОГРАНИЧЕНИЙ

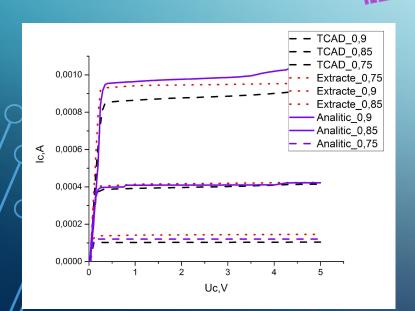
ФИЗИКО-ТОПОЛОГИЧЕСКОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ

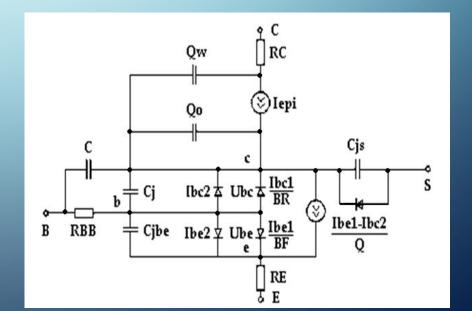
сравнение

Моделирование с пакете ISE T-Cad

Теоретический расчет

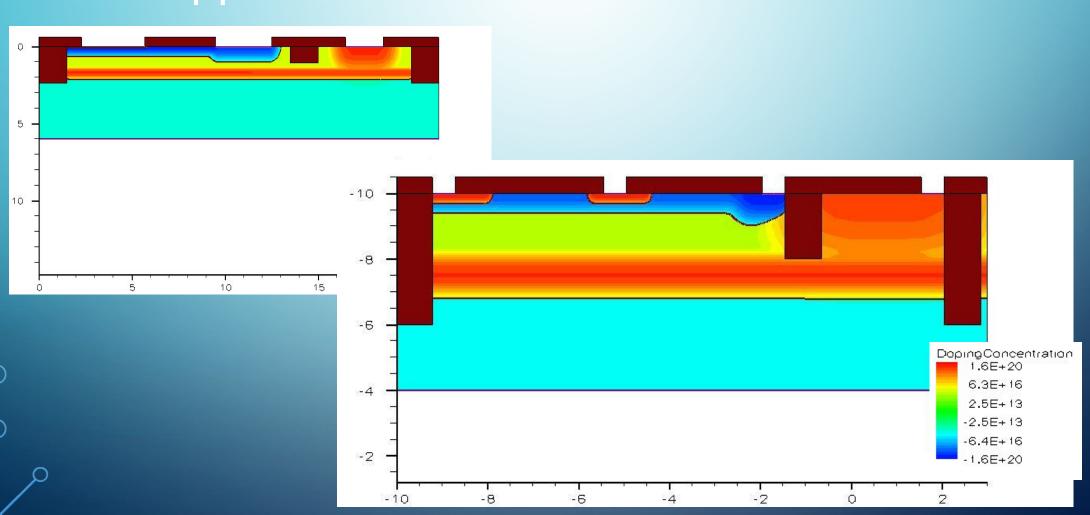
Экстрагирование



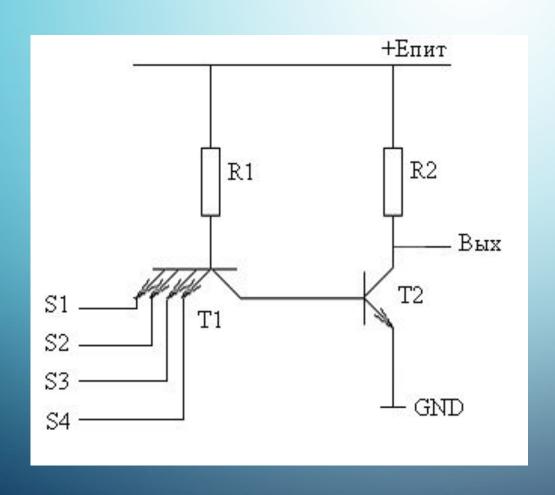


```
Уравнения, связывающие напряжения на электродах транзистора и токи через них, с параметрами
                                                      модели Гуммеля-Пуна
                                         <u>Максимальный</u> коэффициент усиления тока в нормальном
                                        Напряжен \frac{1}{\sqrt{b}e} Эрли в нормальной \frac{1}{\sqrt{b}c} име в напряжен \frac{1}{\sqrt{b}e} Эрли в инве\frac{1}{\sqrt{S}} ном \frac{1}{\sqrt{N}} име, \frac{1}{\sqrt{N}} ние кольемное сопротивлен \frac{1}{\sqrt{N}} интера, Ом \frac{1}{\sqrt{N}} ние кольемное сопротивлен \frac{1}{\sqrt{N}} интера, Ом \frac{1}{\sqrt{N}}
                                         Объемное сопротивление базы, Ом
                                        Время переноса заряда в нормальном режиме, с
                                         Время переноса заряда винверсном режиме, с
                                      е Eмкость эмиттерного дерехода, пф
                                         Емкость коллекторного перехода, пф
                                         Емкость коллектор-подложка, пф
                                         Коэффициент неидеальности эмиттерного перехода
                    NC
                                         Коэффициент неидеальности коллекторного перехода
                    NF
                                         Коэффициент неидеальности эмиттерного перехода
                                         Коэффициент неидеальности коллекторного перехода
                    NR
```

СТРУКТУРА ТРАНЗИСТОРА СМОДЕЛИРОВАННАЯ ПРОГРАММЕ T-CAD



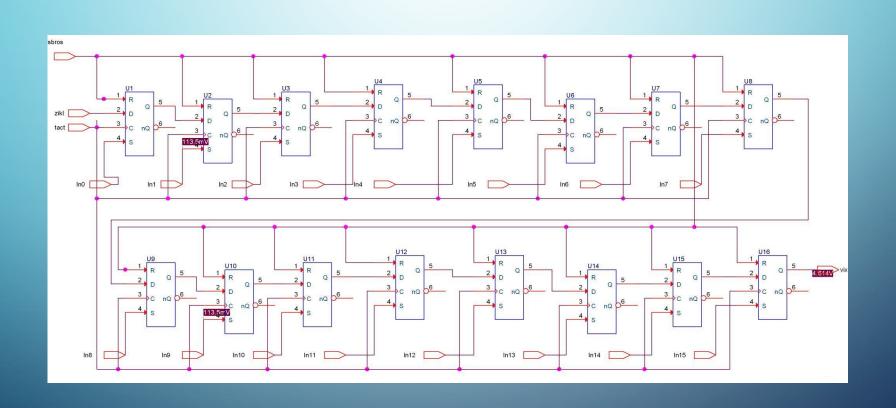
РАЗРАБОТКА ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ СХЕМЫ БАЗОВОГО ВЛЕМЕНТА.



» РАЗРАБОТКА ТОПОЛОГИИ БАЗОВОГО ЛОГИЧЕСКОГО ЭЛЕМЕНТА



РАЗРАБОТКА ТОПОПОГИИ БАЗОВОГО ЛОГИЧЕСКОГО ЭЛЕМЕНТА





СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ !!!